

卓上 SEM 製品紹介 & 実機デモンストレーション(体験利用)

「誰でも SEM/EDS を操作できる」がコンセプトの、日本電子(株)製 新型卓上走査電子顕微鏡 **JCM-7000 NeoScope™**について、製品紹介および実機でのデモンストレーション・体験利用を下記の通り行ないます。教職員・学生のみなさまには多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。

記

日時：令和元年 7 月 9 日(火) 16 時 45 分～17 時 15 分 [製品紹介]

7 月 10 日(水) 10 時 00 分～15 時 00 分 [実機デモ/体験利用]

場所：北海道大学工学部 材料化学棟 2 階 MC215 講義室

講師：日本電子株式会社 グローバル営業推進本部 EO 営業推進室 SM グループ
野村 朋子 様

【体験利用について】

✚ 混雑防止のため、**実機の体験利用は事前申し込みが必要です**。体験利用をご希望の方は担当者までお申し込みください。※見学のみは申し込み不要です。お気軽にご参加ください。

✚ サンプルの持ち込み可能です。

最大試料サイズ：80mmφ × 高 50mm / 観察範囲：40mm 角 ※32mmφ 以内が観察しやすいです。

主催・連絡先：北海道大学 工学部全学共同利用施設 ナノ・マイクロマテリアル分析研究室

担当：宮崎、遠堂 E-mail: info-nma@eng.hokudai.ac.jp TEL 011-706-6363



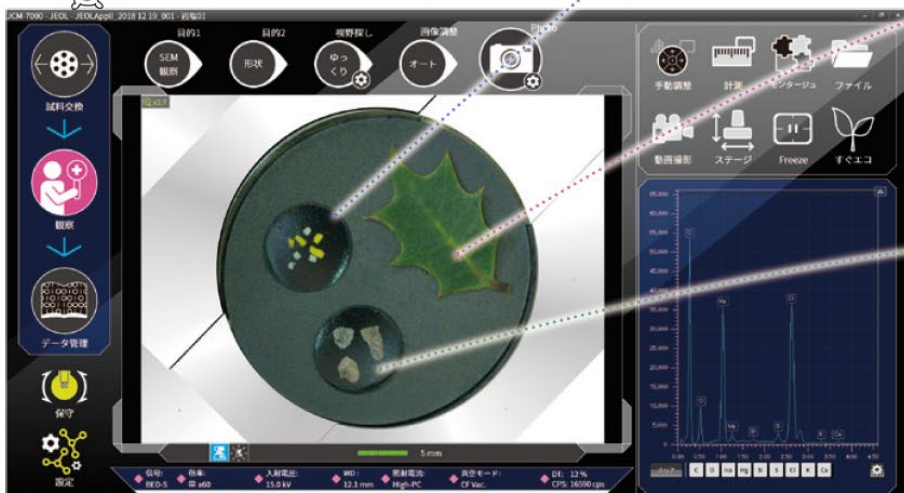
SEM観察の高い操作の壁を破れ！

Zeromag* & 低真空モード

Zeromag* **Zero mag**

SEMの操作画面に最低倍率で表示される画像は、試料挿入時に自動で撮影された光学像です。光学像で視野探しをおこない、観察視野を拡大していくと、自動でSEM像に切り替わります。観察位置への移動をスムーズにおこなえるため、最小限のボタン操作でSEM像が撮影できます。

光学像を拡大していくと、自動でSEM像に切り替わるんだよ！



低真空モード **LV**

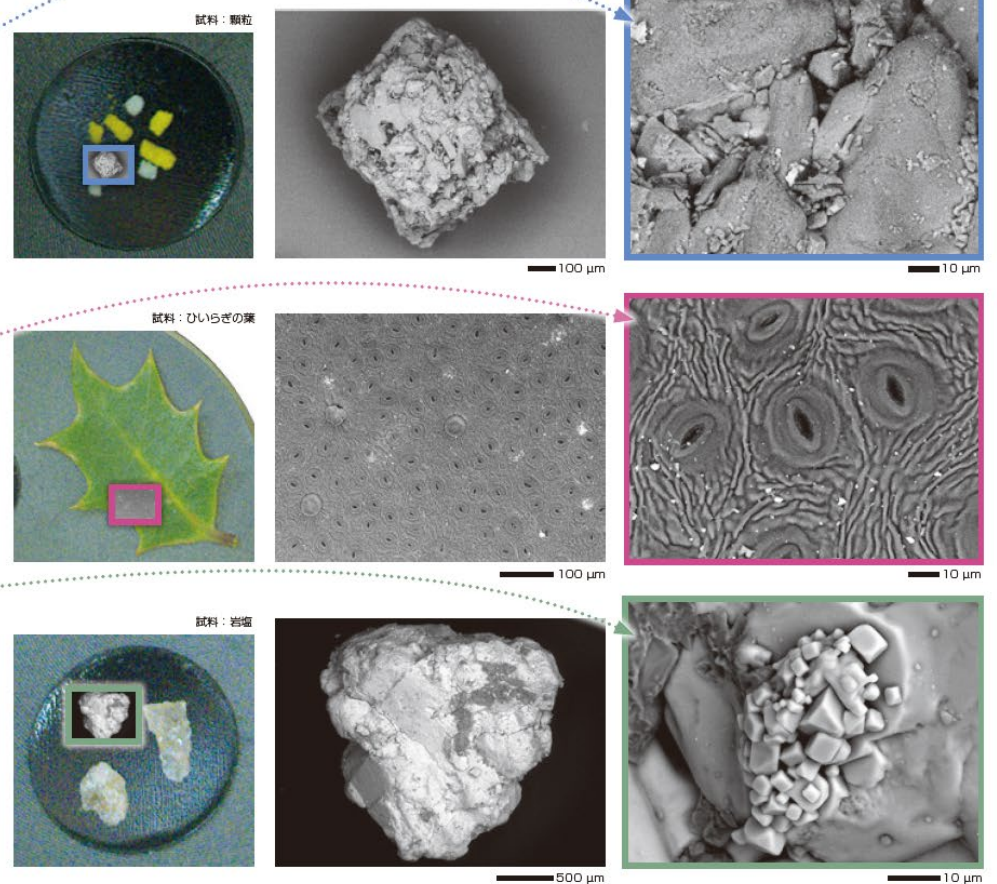
表面形態を鮮明にSEM観察するための高真空モードのほかに、帯電しやすい試料を前処理無しで観察できる2段階の低真空モードが装備され、試料準備も容易になりました。



帯電しやすい試料から前処理無しで観察しやすくなったんだよ！



※製品パンフレットより引用



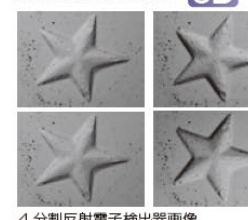
+α 二次元の画像で満足しないLive 3D

新機能

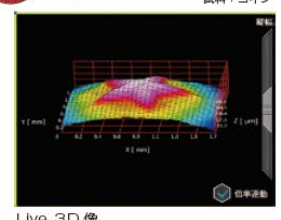
新開発の高感度4分割反射電子検出器によりSEM像と3D画像をLiveで二画面表示することができます。凹凸の分りにくい試料の形状判断が瞬時にできるだけでなく、深さの情報も得られます。

SMILE VIEW™ Map (オプションソフトウェア P14) と組み合わせると面粗さ計測等の詳細な3D解析ができます。

【例】コイン表面の模様



試料：コイン



* Zeromag(光学像)の撮影には、ステージナビゲーションシステム(オプション)が必要です